

1時間あたり利用料金(円・税込)		タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF
		x0.35	x0.50	x0.56	x0.70	x0.80	x1.00
電子顕微鏡	極低温高分解能透過電子顕微鏡 JEOL / JEM-2100F(G5)	7,900	11,280	12,630	15,790	18,050	22,560
	球面収差補正透過電子顕微鏡 JEOL / JEM-2200FS	5,990	8,550	9,580	11,970	13,680	17,100
	モノクロメータ搭載 低加速原子分解能分析電子顕微鏡 JEOL / JEM-ARM200F	8,980	12,840	14,380	17,970	20,540	25,670
試料作製装置群	デュアルビーム走査電子顕微鏡 * (FIB-SEM) JEOL / JIB-4700F	11,630 (13,430)	16,620 (18,420)	18,610 (20,410)	23,260 (25,060)	26,580 (28,380)	33,230 (35,030)
	イオンスライサー JEOL / IB-09060CIS	1,370	1,950	2,180	2,730	3,120	3,900
	精密イオン研磨装置 Gatan / Model691 PIPS	540	780	870	1,090	1,240	1,550
	マイクロトーム Leica / ULTRACUT UCT	540	780	870	1,090	1,240	1,550
技術料	技術代行	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
	技術補助 **	3,080	4,400	8,800	8,800	8,800	8,800

\* カッコ内はFIB利用時の料金(Gaイオン源利用料として30円/分を加算) \*\* 割引は学術研究機関の利用にのみ適用

タイプ 利用者の所属する機関の種類	成果公開		成果 非公開
	データ提供 あり	データ提供 なし	
学術	A	B	—
共同研究***	A	B	E
中小企業	A	B	F
大企業	C	D	F

\*\*\* 学術研究機関との共同研究による企業の利用

## 補足事項

通常と異なる消耗品を使用する場合には消耗品費実費を請求することがあります。  
(高温ホルダ用特殊メッシュ・薄型カーボン膜等の高額なもの、あるいは大量に使用する場合等)

機器利用前後のデータ解析や試料前処理等の依頼については、技術料(技術代行・技術補助)を請求させていただきます。  
利用区分・利用料金における「中小企業」は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条における中小企業を指します。  
機器利用前後のデータ解析や試料前処理等の依頼については、技術料(技術代行・技術補助)を請求させていただきます。

利用区分・利用料金における「共同研究」は、京都大学に限らない学術研究機関との共同研究を指します。  
(契約書等の証明書を提示いただく場合があります)

成果の公開・非公開は、年度末の利用報告書の提出の有無に対応します。利用報告書は必要に応じて提出後2年間まで公表を猶予することができます。

データ提供の有無は、利用にかかわる主要な「電子顕微鏡写真」・「測定・分析データ」、「測定・観察条件」、「試料に関する情報」の提供の有無に対応いたします。将来的に機械学習などに利用されるデータベースの一部として公開されます。公開される項目については、利用者の意思が反映されますが、最低基準を満たさない場合はこの区分での利用をお断りすることがあります。現在のところ詳細が決定しておりませんので、当面は提供の意思があるかどうかをご記入いただき、詳細決定後にあらためてデータ提供の意思を確認し、データを提出していただくこととなります。こちらも提出後2年間まで公開を猶予することができます。